Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/604,343	CHANG ET AL.
Examiner	Art Unit

2876

Thien M. Le

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
235	472.01			
<del>*</del> .	462.01			
	462.33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	462.43			
	454			
	494			
	483			
•	479		·	
	475	12/12/2005	LTM	
		·		
•				

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		,,,	

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	STRATEGY	)
•	DATE	EXMR
•		=
•	,	
•		
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	-00	
	4	
•		